

# 走査型電子顕微鏡

破面観察による破壊原因の調査, 異物の分析

[型式]

日本電子 JSM-6510A

[仕様]

分解能 3nm, 加速電圧 $\sim$ 30kV, 最大試料サイズ 150mm $\Phi$ ,  
分析可能元素 Be $\sim$ U, エネルギー分解能 133eV

[設置年度]

2010年度(平成22年度)

